

1. Record Nr.	UNISA996581164703316
Titolo	VTS : 2019 IEEE 37th VLSI Test Symposium : 23-25 April 2019, Monterey, CA, USA // Institute of Electrical and Electronics Engineers
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : Institute of Electrical and Electronics Engineers, , 2019
ISBN	1-7281-1170-6
Descrizione fisica	1 online resource (601 pages)
Disciplina	621.395
Soggetti	Integrated circuits - Very large scale integration - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia